

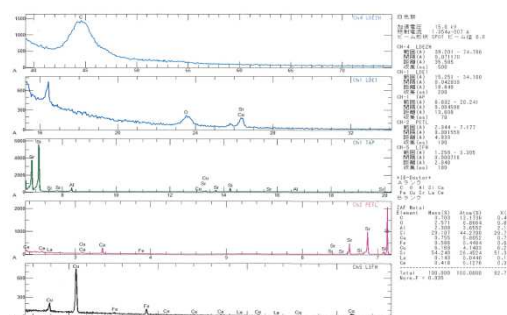
電子プローブマイクロアナライザー

【日本電子株式会社製 JXA-8530FPlus】 令和2年6月導入

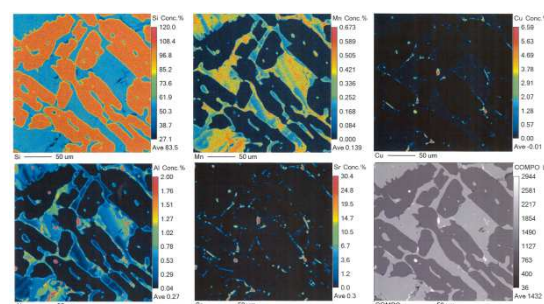


- ・微小領域(数 μm ～)に存在する元素を感度良く分析できます。
- ・面分析(マッピング)機能により元素の分布を調べることができます。
- ・センサ数が多いため高効率です。軽元素対応センサも備えます。

仕様	
電子銃	インレンズショットキー電界放出形
検出器	WDS：5チャンネル 10結晶 LiF、PET、TAP 各2 人工超格子 B、C、N、O用 各1 EDS：SD検出器
分析対象	固体（飛散しやすい粉末は除きます） 例) 金属、セラミックス、電子部品等
試料サイズ	最大 100mm×100mm×50mm ※ステージ移動範囲 X90 Y90 Z7.5mm
分析可能元素	ほう素（ ${}^5\text{B}$ ）～ウラン（ ${}^{92}\text{U}$ ）
分析機能	・定性分析 ・定量分析（ZAF補正、検量線法） ・面分析：ステージ/ビームスキャン（ZAF定量マッピング、EDS併用可）
試料調製	絶縁体は導電コーティングが必要です



定性分析：含有する元素を同定



面分析：元素の分布を調査

使用方法	
	項目
委託分析試験	EPMA定性分析、EPMAデジタルマッピング、EDS定性分析、電子顕微鏡写真
設備使用	電子プローブマイクロアナライザー

* 料金は別途料金表をご確認ください。